

highLIGHT

高分辨率平场XUV光谱仪


**Top
Unistar**
Explore the unknown

SXR
XUV



hpspectroscopy


产品特点

高光谱分辨率

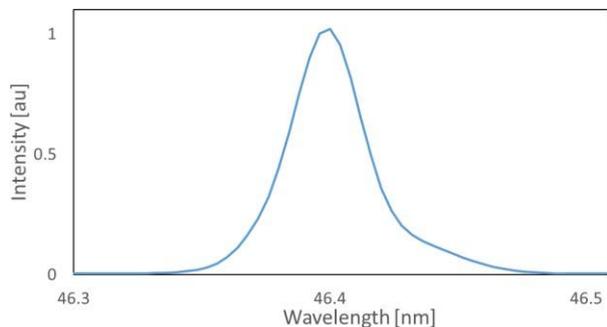
- 覆盖1 ~ 100nm波长范围
- 结合用户的平场配置实现最佳的光谱分辨率
- 极高光谱分辨率，宽光谱范围和极高信噪比的独特组合

高效率

- 无狭缝设计:无需对准敏感的窄入口狭缝
- 比标准的光谱仪高出约20倍的光收集效率和信噪比

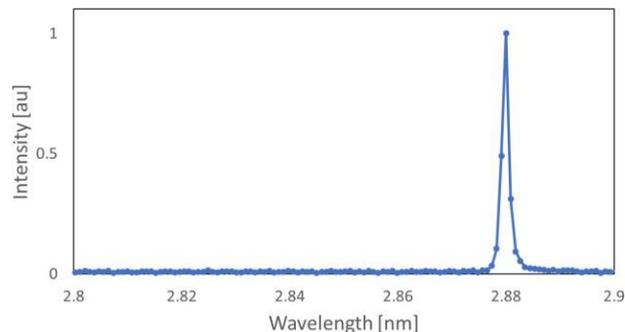
精度和效率

- 绝对光栅位置监控，用于保持光栅对准
- 高效像差校正平场光栅
- 友好的软件控制体验
- 定制化服务
- 根据客户要求定制



使用highLIGHT XUV光谱仪获得的高次谐波源的高分辨率光谱。图为利用倍频的波长为1 μ m的光纤激光器在氩气中获得的（经铝滤片过滤）第11阶高次谐波谱。相机像素尺寸为13 μ m，对应的分辨能力达到1340。

(data courtesy of Dr. J. Rothhardt, Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering)



用 highLIGHT SXR+ 在 2.88nm（430eV，对应1s₂-1s₂p跃迁）处对氮谱线进行发射光谱测量。半高全宽是CCD相机的1.74倍（13 μ m像素大小），对应分辨能力为1890。该探测器的极限分辨能力可达3290。

(data courtesy of Dr. K. Mann, Laser-Laboratorium Göttingen)

规格参数

Topology类型	像差校正平场光谱仪
波长范围	1-100nm
光源距离	可根据用户实际光路灵活调整
探测器类型	CCD or MCP/CMOS
真空兼容度	< 10 ⁻⁶ mbar (UHV超高真空版可定制)
无狭缝技术	是
入射狭缝	可选
光栅定位	闭环电控台
滤光片插入装置	含
控制接口	USB 或 Ethernet
软件	Windows UI and Labview/VB/C/C++ SDK
定制化	可根据需求定制
可选项	非磁性, 旋转几何等

	SXR+	SXR	XUV
波长范围	1-5nm	1-20nm	5-100nm
色散能力	0.06nm/mm	0.1-0.2nm/mm	0.2-0.7nm/mm
分辨率	<0.001nm at 3nm	<0.005nm at 10nm	<0.02nm at 60nm



请联系我们

北京众星联恒科技有限公司

北京市海淀区信息路1号国际创业园西区2号楼1305

电话: +86-10-86467571 邮箱:sales@top-unistar.com

关注我们